セミナー参加申込方法

参加ご希望の方は 弊社ホームページ(http://www.hayasaka-rikoh.co.jp)の参加登録フォームにてお申込みください。
登録完了後に弊社より登録確認のご連絡を申し上げます。
（なお各セミナーは定員になり次第、締め切りとさせて頂きますのでご了承願います）

FAXでのお申し込みの場合は 下記の申込書をご利用ください。

セミナー参加申込書(FAX用)

早坂理工株式会社 東関東営業所 行　　FAX048－963－2696

勤務先		ﾌﾘｶﾞﾅ 氏 名	
所 属		電話番号	
電子ﾒｰﾙ	（参加登録終了後にご連絡をさせて頂きますのでご記入願います。もしくはFAX番号でも可です）		

※ A,B会場とC,D会場は セミナー開始時刻が異なっておりますのでご注意ください。

	セミナーA会場	セミナーB会場		セミナーC会場	セミナーD会場
9:30～ 10:20	次世代技術を利用した計測手法のご紹介 （共和電業） ☐	屋外暴露と各種促進試験機の相関 （スガ試験機） ☐	10:00～ 10:50	断面観察試料作製のノウハウを教えます！（ビューラー） ☐	信頼性評価技術の最新動向 （エスペック） ☐
10:35～ 11:25	高速カメラで実現する究極な生産性ツール（フォトロン） ☐	腐食試験の概要と海外試験規格動向（スガ試験機） ☐	11:05～ 11:55	非接触表面粗さ測定方法について （オリンパス） ☐	小型卓上型X線回折装置miniFlexのご紹介（リガク） ☐
	休憩時間（50分）	休憩時間（50分）		休憩時間（50分）	休憩時間（50分）
12:15～ 13:05	FFTアナライザーの活用方法 （小野測器） ☐	最適な3Dプリンタの選び方 （アルテック） ☐	12:45～ 13:35	屋外暴露と各種促進試験機の相関 （スガ試験機） ☐	分光測定による異物分析 （日本分光） ☐
13:20～ 14:10	低周波EMC規格試験の基礎（エヌエフ回路設計ブロック） ☐	標準物質校正システム （堀場エステック） ☐	13:50～ 14:40	腐食試験の概要と海外試験規格動向（スガ試験機） ☐	非接触の光学特性評価と薄膜計測技術 （大塚電子） ☐
14:25～ 15:15	ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟとﾌﾟﾛｰﾌﾞの基礎（テレダイン・レクロイ・ジャパン） ☐	温度測定のノウハウを教えます （チノー） ☐	14:55～ 15:45	非接触センシングの応用事例 （東京精密） ☐	ハイスループット電子顕微鏡と蛍光X線装置（日本電子） ☐
15:30～ 16:20	AC非接触プローブ測定手法と熱流センサー（日置電機） ☐	湿度・露点の測定と無結露制御を極める （第一科学） ☐			

上記聴講ご希望のセミナーの□にチェックをいれて頂き FAX願います。　　FAX 048－963－2696

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2
"ラフレさいたま 5階"

【 交通のご案内 】
● 電車をご利用の場合
JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線
「さいたま新都心駅」下車徒歩約7分
JR埼京線「北与野駅」下車徒歩約10 分
※ 東北新幹線をご利用の方は「大宮駅」でお乗換えください。
● 車をご利用の場合
高速さいたま新都心線 新都心出口から約400m
※ 駐車場(有料)は台数に限りがありますので、なるべく電車をご利用ください。

計測・分析・環境・試験

参加無料

70th 早坂理工 ビジネスパートナーシップ 2017 技術セミナー&展示会

さいたま新都心

日時：平成29年10月11日(水)
9:30～17:00

会場：ラフレさいたま 5階
（裏面の地図を参照下さい）

早坂理工株式会社

協賛メーカー(31社)

- スガ試験機
- インストロン
- テレダインレクロイ
- ITWジャパン(ビューラー)
- クラボウ
- リガク
- 千代田エレクトロニクス
- NF回路設計ブロック
- 神栄テストマシナリー
- アルテック
- フィッシャー・インストルメンツ
- 興研
- 東京科研(オルガノ)
- 日本分光
- ジャスコインターナショナル
- 京西テクノス
- 共和電業
- チノー
- グラフテック
- 小野測器
- 堀場エステック
- 第一科学
- オリンパス
- 大塚電子
- エスペック
- フォトロン
- 日置電機
- 大亜真空
- 日本電子
- ノイズ研究所
- 東京精密

（順不同・敬称略）

商談室もございます。

平素は、大変お世話になり厚くお礼申し上げます。
おかげさまで弊社は創業70周年を迎えることができました。
そこでこの度70thAnniversary企画と致しまして技術セミナーと計測機器・試験機器等の展示会を開催します。
厳選した最新情報をご提供させて頂きますので是非お越しくださいませ。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

大抽選会も開催 ！

や

等の

景品も用意しています。

各セミナーの受講登録は下記の弊社ホームページ もしくは裏面による申込書をFAXにて送付願います。

http://www.hayasaka-rikoh.co.jp

早坂理エビジネスパートナーシップ2017 セミナープログラム

セミナー会場 A　定員30名

9:30～10:20　A－1　株式会社共和電業
【タイトル】 次世代技術を利用した計測手法のご紹介
【コンテンツ】 カメラによる多点同時微小変位分布計測・振動計測や光ファイバーセンサによる多点同時計測の事例等をご紹介します。

10:35～11:25　A－2　株式会社フォトロン
【タイトル】 高速カメラで実現する究極な生産性向上ツールのご紹介
【コンテンツ】 高速カメラを利用しての、生産性の向上事例をご紹介。研究開発の各種試験（落下、引張、衝撃　等）の可視化、製造工程検証、実際に撮影した映像でご紹介します。

50分間休憩　（展示会場へもお越しください）

12:15～13:05　A－3　株式会社小野測器
【タイトル】 FFTアナライザの活用法
【コンテンツ】 周波数分析を行う事で何が便利なのか、何が分かるのかをFFTの基礎と用途例でご紹介します。

13:20～14:10　A－4　株式会社エヌエフ回路設計ブロック
【タイトル】 低周波EMC規格試験の基礎
【コンテンツ】 電圧ディップ・短時間停電・電圧変動試験に関する試験装置のご紹介とIEC規格に準拠した試験方法についてご紹介します。

14:25～15:15　A－5　テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社
【タイトル】 オシロスコープとプローブの基礎
【コンテンツ】 デジタル・オシロスコープの動作原理や基本仕様等と、様々なプローブの動作原理と注意点などについて解説します。

15:30～16:20　A－6　日置電機株式会社
【タイトル】 世界初AC非接触プローブ測定手法と熱流センサーのご紹介
【コンテンツ】 AC非接触プローブの測定手法のご紹介及び熱流センサーによる熱解析アプリケーション等もご紹介します。

セミナー会場 B　定員30名

9:30～10:20　B－1　スガ試験機株式会社
【タイトル】 屋外暴露と各種促進試験機の相関について
【コンテンツ】 屋外暴露1年に相当する各試験機の時間は？屋外暴露と相関性を持たせ、試験スピードをさらに短縮させる手法をご紹介します。

10:35～11:25　B－2　スガ試験機株式会社
【タイトル】 腐食試験の概要と最新の海外試験規格の動向
【コンテンツ】 世界中の自動車メーカーは独自の腐食試験を行っている。今回はドイツ（New－VDA）・フランス（ECC1）等の試験方法とそれらに対応する試験機をご紹介します。

50分間休憩　（展示会場へもお越しください）

12:15～13:05　B－3　アルテック株式会社
【タイトル】 3Dプリンタ導入セミナー（最適な3Dプリンターの選び方）
【コンテンツ】 3Dプリンタの仕組みと導入へのポイントを説明治工具、射出成型、最終製品など製造現場での活用事例をご紹介します。

13:20～14:10　B－4　株式会社堀場エステック
【タイトル】 3つの「世界初！」 標準物質校正システム
【コンテンツ】 標準物質がない！有機化合物の定量測定についてご紹介します。最新のマスフローコントローラーもご紹介をします。

14:25～15:15　B－5　株式会社チノー
【タイトル】 温度測定のノウハウ教えます！！
【コンテンツ】 意外と知らない温度測定方法と低コストでできる集中監視システムをご紹介します。

15:30～16:20　B－6　株式会社第一科学
【タイトル】 湿度・露点の測定と無結露制御を極める
【コンテンツ】 これまで実現できなかった分析装置への精密な湿度制御や氷点下での湿度制御、世界初の無電源湿度校正器等を解り易くご紹介します。

セミナー会場 C　定員30名

※C,D会場はA,B会場と、セミナー開始時刻が異なっておりますのでご注意ください。

10:00～10:50　C－1　ITWジャパン ビューラー
【タイトル】 断面観察試料作製のノウハウ教えます！！
【コンテンツ】 様々な材料解析用試料作りに際しSUMMET法により最適な研磨レシピ・機器選定・消耗品選定等をご紹介します。

11:05～11:55　C－2　オリンパス株式会社
【タイトル】 非接触表面粗さ測定方法について
【コンテンツ】 3D測定レーザー顕微鏡の原理特徴と表面形状測定をご紹介します。また　顕微鏡・マイクロスコープの最新情報をご紹介します。

50分間休憩　（展示会場へもお越しください）

12:45～13:35　C－3　スガ試験機株式会社
【タイトル】 屋外暴露と各種促進試験機の相関について
【コンテンツ】 屋外暴露1年に相当する各試験機の時間は？屋外暴露と相関性を持たせ、試験スピードをさらに短縮させる手法をご紹介します。

13:50～14:40　C－4　スガ試験機株式会社
【タイトル】 腐食試験の概要と最新の試験動向
【コンテンツ】 世界中の自動車メーカーは独自の腐食試験を行っている。今回はドイツ（New－VDA）・フランス（ECC1）等の試験方法とそれらに対応する試験機をご紹介します。

14:55～15:45　C－5　株式会社東京精密
【タイトル】 非接触センシングの応用事例紹介
【コンテンツ】 ゴム等の形状が変わりやすい素材や、接触させるとキズが入りやすいガラス・銅等の今まで測定が難しかったワーク測定のお悩みを解決します。

15:55～16:45　C－6

参加申込多数のセミナーを追加予定です。

セミナー会場 D　定員30名

10:00～10:50　D－1　エスペック株式会社
【タイトル】 信頼性評価技術の最新動向
【コンテンツ】 規格試験及び自動車市場における信頼性試験のご紹介エレクトロニクス製品・カーエレクトロニクスの試験動向や加速試験・Air-Hast試験などの試験動向をご紹介します。

11:05～11:55　D－2　株式会社リガク
【タイトル】 小型機でここまでできる!!　卓上型X線回折装置MiniFlexのご紹介
【コンテンツ】 X線回折の原理について解説。卓上型ながら大型上位機種並みの性能を持たせたX線回折装置。医薬品や工業材料の品質管理、新材料の研究開発、教育用に最適

50分間休憩　（展示会場へもお越しください）

12:45～13:35　D－3　日本分光株式会社
【タイトル】 分光測定による異物分析
【コンテンツ】 FT-IRとRamanを用いた異物分析が広く行われています。ここでは、それぞれの装置の測定原理に加え異物分析の事例から最新のアプリケーションまでを紹介します。

13:50～14:40　D－4　大塚電子株式会社
【タイトル】 非破壊非接触の光学特性評価と薄膜計測技術
【コンテンツ】 R&D、品質管理、組込用途で楽々対応が可能な非破壊・非接触の新しい膜厚計の詳細と各種最新のアプリケーションをご紹介します。

14:55～15:45　D－5　日本電子株式会社
【タイトル】 ハイスループット走査電子顕微鏡と蛍光X線分析装置
【コンテンツ】 観察中にも分析可能。リアルタイムで元素を把握が出来るSEM。検量線はもう不要？樹脂分析や微量分析にも適応したスマートFP法を用いた蛍光X線分析をご紹介。

15:55～16:45　D－6

参加申込多数のセミナーを追加予定です。

10:00～16:30　特設展示会場（百乃間）にて 合計31社のメーカーによる 最新の計測機器・試験機器等の展示を致しておりますので是非お立ち寄りください。

展示外商品も含まれますのでご了承ください。